

表面分析の基礎、原理、および応用

1名分料金で
2人目無料

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/250910>

- ◆日時:2025年09月26日(金) 10:30~16:30
- ◆【アーカイブ配信:9月29日(月)~10月10日(金)(何度でも受講可能)】
- ◆受講料:1名につき55,000円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から
 ・1名で申込の場合、**49,500円(税込)**へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録していただいた場合、**計55,000円(2人目無料)**です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師: 合同会社 I・R・D CEO 博士(理学) 古田 啓 氏

【習得出来る知識】

- ・表面分析に用いるX線、電子、イオンの特徴とこれらと表面の相互作用を理解できる。
- ・SEM-EDS、AFM、XPS、SIMS、等、代表的な表面分析法の基礎・原理を理解できる。
- ・分析装置の一般的な仕組みを理解できる。
- ・各表面分析の相対的な位置づけを理解できる。
- ・表面分析の結果を適切に解釈できるようになる。

【講演の趣旨】

本セミナーでは、基礎事項として、サンプル表面に入射するX線、電子、イオンの特徴、これらと表面との相互作用、出力に至るまでの信号の流れ、等を分かり易く解説します。また、代表的な表面分析の原理や分析結果の例を紹介しします。加えて、表面分析の応用として、マッピング、深さ分析について説明します。

【プログラム】

1. 表面分析の概要

- 1-1. はじめに
- 1-2. 代表的なフロー
(入射→相互作用→認識)

2. 表面分析の構成要素

- 2-1. 入射
(1)X線 (2)電子 (3)イオン
- 2-2. 相互作用
(1)X線と表面の相互作用
(2)電子と表面の相互作用
(3)イオンと表面の相互作用
- 2-3. 認識
(1)検出器 (2)表示

2-4. その他

- (1)真空 (2)ステージ

3. 表面形状観察

- 3-1. 光学顕微鏡
- 3-2. SEM
- 3-3. レーザー顕微鏡
- 3-4. SPM

4. 表面元素等分析

- 4-1. XRF
- 4-2. XPS
- 4-3. AES
- 4-4. S-SIMS

5. 表面分析の応用

- 5-1. マッピング
(1)SEM-EDS (2)EPMA
(3)AES (4)S-SIMS
(5)XRF (6)XPS
- 5-2. 深さ分析
(1)D-DIMS
(2)スパッタリングの併用
…XPS, AES, S-SIMS
(3)RBS

6. 補足

7. まとめ

『表面分析』セミナー申込書<■LIVE ■アーカイブ> ※いずれかにチェックしてください

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本にお受けしていませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送